PAT-NO:

JP404186626A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04186626 A

TITLE:

ETCHING APPARATUS

PUBN-DATE:

July 3, 1992

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HARADA, YOSHITAKA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC YAMAGUCHI LTD N/A

APPL-NO: JP02311856

APPL-DATE: November 16, 1990

INT-CL (IPC): H01L021/306 , H01L021/304

ABSTRACT:

PURPOSE: To eliminate etching residue by always varying a contact surface of a wafer with a member for holding the wafer during processing, and to prevent generation of particles in a later step and diffusion of impurities into a semiconductor substrate by exposing the entire surface of a wafer with a spray nozzle upon rotation of a rotary shaft

and a cam rotary shaft, and always holding the wafer by three chucking pawls.

CONSTITUTION: In this etching apparatus, a wafer 21 is held by three chucking pawls. Then, a motor 12 is rotated to rotate a rotary shaft 1 and a cam rotary shaft 2. The position of a bracket 8 of the shaft 1 is varied to a cam 4 so that the pawls 3 are separated from the side of the wafer 21. A push rod 5 is moved in a central direction by the contour of a cam plate, the pawls 3 mounted on the other end are moved forward to push the wafer. As the shaft 1 rotates in this manner, the three pawls 3, always alternately hold the wafer 21. As a result, the wafer 21 is not disturbed in its visual field for spraying, and the wafer 21 can be entirely coated with processing solution uniformly.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

DERWENT -

1992-273238

ACC-NO:

DERWENT- 199233

WEEK:

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Wet etching equipment for prodn. of

semiconductor device - has spin wafer

table with wafer hold pins which

alternately release from wafer edge during

spray of etching solution NoAbstract

PATENT-ASSIGNEE: YAMAGUCHI NIPPON DENKI KK[NIDE]

PRIORITY-DATA: 1990JP-0311856 (November 16, 1990)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC July 3, N/AJP 04186626 004 H01L Α 1992 021/306

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL- DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
JP	N/A	1990JP-	November 16,
04186626A		0311856	1990

INT-CL (IPC): H01L021/304, H01L021/306

ABSTRACTED-PUB-NO:

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

TITLE- WET ETCH EQUIPMENT PRODUCE SEMICONDUCTOR

TERMS: DEVICE SPIN WAFER TABLE WAFER HOLD PIN

ALTERNATE RELEASE WAFER EDGE SPRAY ETCH

SOLUTION NOABSTRACT

DERWENT-CLASS: U11

EPI-CODES: U11-C07B; U11-F02A2;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1992-209017

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-186626

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成 4 年(1992) 7 月 3 日

H 01 L 21/306 21/304 21/306

R N 3 4 1

7342-4M 8831-4M

7342-4M

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

60発明の名称

エツチング装置

②特 願 平2-311856

頤 平2(1990)11月16日 22出

@発 明 者 原 田 袭 隆

山口県厚狭郡楠町大字東万倉字神元192番地-3 山口日

本電気株式会社内

願 包出 山口日本電気株式会社

山口県厚狭郡楠町大字東万倉字神元192番地-3

個代 理 人 弁理士 内原

阴

発明の名称

エッチング装置

特許請求の範囲

1. ウェーハの表裏面側に配置するとともにウ ェーハの表裏面に処理液を吹き付けるスプレーノ ズルと、一端に中心より外方に伸びる6等分され たブラケットが取付けられるとともに所定の回転 数で回転する回転軸と、この回転軸と同軸である とともに前記回転軸の回転数と異なる回転数で回 転し、その先端にカムが取り付けられるカム回転 軸と、前記ブラケット上を回転半径方向に摺動す るとともにその先端が前記カムの外側面と接触す るプッシュロッドと、このアッシュロッドの他端 に取付けられるとともに前記ウェーハの外側面に 接触したり、離間したりするチャック爪とを備 え、前記回転軸と前記カム回転軸の回転に伴い。 前記ウェーハ全面を前記スプレーノズルに対して

露呈し、常に3個の前記チャック爪で前記ウェー ハを保持することを特徴とするエッチング装置。

2. 相対する前記ブラケットの先端に取付けら れる鼓状の自転ローラ及び回転ローラと、この回 転ローラの軸の他端に取付けらるアーリーと、前 記回転軸を包むとともに一端に前記アーリーをベ ルトを介して前記回転軸の回転に伴い回転させる 固定アーリーが取付けられる固定軸とを備え、前 記ウェーハの外側面を前記自転ローラと前記回転 ローラとで挟み保持することを特徴とする請求項 1 記載のエッチング装置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体基板であるウェーハの薄膜をエ ッチングするエッチング装置に関する。

〔従来の技術〕

第3図は従来のエッチング装置の一例を示す斜 視図である。従来、このエッチング装置は、同図 に示すように、ウェーハ22をその裏面と側面を

保持するチャック19と、このチャック19に保持されたウェーハ21を回転させる回転機構と、ウェーハ21の表面と裏面とから処理液を吹き付ける表面スプレーノズル20及び裏面スプレーノズル20aとを有していた。

このエッチング装置で、ウェーハの薄膜をエッチングする場合は、まず、薄膜が形成されたウェーハ19をチャック22で保持し、ウェーハ19を回転させるから、薄膜面上に表面スプレーノズル20と裏面スプレーノズル21で処理液を吹き付けエッチングを行っていた。

[発明が解決しようとする課題]

上述した従来のエッチング装置の場合、次の問題が生じる。

ウェーハ表裏面からのスプレーにより、薄膜をエッチングしようとする場合、ウェーハとチャックとの接触面に処理液が侵入できないために、この部分にエッチング残りが生じる。このエッチング残りは、後工程において湿式処理、無処理を行なう際に、剣れるためパーティクルとなり、半導

体デバイスの歩留りを低下させる原因となっていた。特に半導体差板上の薄膜に不純物導入が行なわれている場合、後工程での無処理により不純物がウェーハ面内に拡散し、半導体デバイスの電気的特性を変化させるという欠点がある。

本発明の目的はかかる同題を解決するエッチング装置を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

離間したりするチャック爪とを備え、前記回転軸と前記カム回転軸の回転に伴い、前記ウェーハ全面を前記スプレーノズルに対して露呈し、常に3個の前記チャック爪で前記ウェーハを保持することを特徴としている。

2. 本発明の第2のエッチング装置は、相対する前記プラケットの先端に取付けられたローラ及び回転ローラと、この回転のの触に取付けらるアーリーをベルルをの地にでが取付けられる固定軸とを備え、前記ローラとで決み保持することを特徴としている。

(実施例)

次に本発明について、図面を参照して説明する。第1図(a)及び(b)は本発明の一実施例を示すエッチング装置の上面図及び部分断面図である。このエッチング装置は、第1図(a)及び(b)に示すように、中心より6等分されて外方

に伸びるブラケット8を一端に設け、他端がアー リー11b及びベルト10bを介してモータ12 により回転される回転軸1と、この回転軸4には め込まれるとともに一端にカム4を取付け、他端 がプーリー11a及びベルト10aを介してモー タ12により回転されるカム回転軸2と、ブラケ ット8の溝にはめ込まれ、回転半径方向に摺動 し、ウェーハ21の側面を押し付けるチャック爪 3と、先端がカム4の外側面にスプリング6によ り所定圧で接触するとともに他端がチャック爪3 に取付けられたアッシュロッドちとで構成されて いる。また、この図面には示されていないが、ウ ェーハ21の表裏側に処理液を吹き付けるスプレ ーノズルが配置されている。さらに、回転軸1と カム回転軸とは回転数に差があり、外周では所定 の速度差が生ずるようにされている。

次に、このエッチング装置の動作を説明する。 まず、各チャック爪3をスプリング6に抗して、 チャック爪3を開き、ウェーハ21を三つのチャ ック爪3で挟む、このことは、残りのチャック爪

3は、必ず、カム4の輪郭でアッシュロッド5が 押され、開いているからである。次に、モータ 12を回転し、回転輸1及びカム回転輸2を回転 させる。このことにより、互いに回転数の差があ るために、回転軸1のブラケット8の位置がカム 4に対して変る。この変ることにより、チャック 爪3がウェーハ21の側面より離れていたもの は、カム板の輪郭によりアッシュロッド5が中心 方向に移動し、他端に取付けられたチャック爪3 前進し、ウェーハを押し付ける。このような、回 転軸1の回転にともない、常に、三つのチャック 爪3が交互にウェーハ21を挟み固定することに なる。また、ウェーハ21にはオリエンテーショ ンフラット23が形成されているが、この部分 は、中心角が60°より小さいので、チャック爪 3と接触することがない。

このような構造にすることにより、ウェーハ 21はスプレーに対して視界を妨げるものがなく なり、ウェーハ23の全面に一様の処理液が塗布 される。

1 2 a を回転させ、アーリー 1 1 c と 1 1 1 d により回転軸 1 a を回転させる。このことにより回転軸 1 1 2 との相対的な回転差により回転 1 1 2 との相対的な回転差によりりではした。 ウェーフ 1 5 との接触面は刻々と変化されている。 いっつう 1 6 は固定軸 1 3 に接続されているの自由に回転でき、ウェーフ 1 5 のの回転中心ずれ、及びすべりを防止する機能となっている。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明のエッチング装置は、処理中にウェーハとウェーハを保持することの接触面を常に変化させる手段を設けることにか出来、接触部分及びその近の傍にもエッチングスの発生、及び無処理時の不純物の半導体を別への拡散を防止することができるという効果がある。

第2図(a)及び(b)は本発明の他の実施例を示すエッチング装置の上面図及び側面図である。このエッチング装置は、第2図(a)及び(b)に示すように、回転軸1aの一端側をから外方に伸びるブラケットの先端に相対して自転ローラ16と回転ルトラ15とを設け、この回転ローラ15とである。それ以外は、前述の実施例とほぼ同じである。

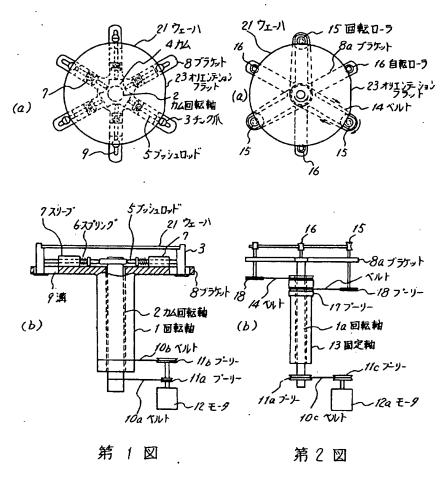
このエッチング装置の動作は、まず、自転のエッチング装置の動作は、まず、自転の目転の目転の目転の目転の目転の目転の目が取付けられているブラケット8aは、一方の面を切り、こので、この引張力で間隔を拡げるこの転がので、このはげられた自転ローラ16と配回にウェーハ21を挿入し、自転のローラ16と離すと、ウェーハ21は自転のローラ15とで挟み固定される。次に、モーターカーを受ける。

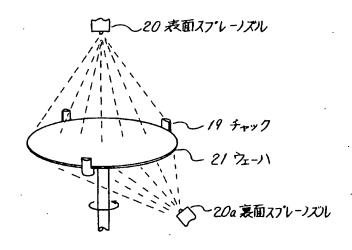
図面の簡単な説明

第1図(a)及び(b)は本発明の一実施例を示すエッチグ装置の上面図及び部分断面図、第2図(a)及び(b)は本発明の他の実施例を示すエッチング装置の上面図及び側面図、第3図は従来の一例を示すエッチング装置の斜視図である。

1 . 1 a … 回転軸、 2 … カム回転軸、 3 … タップ爪、 4 … カム、 5 … アッシュロッド、 6 … スプリング、 7 … スリーブ、 8 . 8 a … ブラケット、 9 … 溝、 1 0 a . 1 0 b . 1 0 c … 1 4 … ベルト、 1 1 a . 1 1 b . 1 7 . 1 8 … アーリー、 1 2 . 1 2 a … モータ、 1 3 … 固定軸、 1 5 … 回転ローラ、 1 6 … 自転ローラ、 1 9 … チャック、 2 0 … 表面スプレーノズル、 2 1 … ウェーハ、 2 2 … 欠番、 2 3 … オリエンテーションフラット。

代理人 弁理士 内 原 智





第 3 図